

Сведения о метрологическом обеспечении

№ п/п	Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров)	Наименование СИ, тип (марка)	Метрологические характеристики СИ		Свидетельство о поверке СИ или сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия)
			Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность	
1	2	3	4	5	6
1	Размеры и морфология клеток	Электронный микроскоп трансмиссионный JEM 1400 (JEOL, Япония), зав. № EM 1848000440044	Увеличение × 200 до × 800000	Разрешение по точкам 3.8 Å и по линиям 2 Å	Сертификат № EM11J0039 от 10.08.2011
2	Размеры и морфология клеток	Электронный микроскоп трансмиссионный JEM 100CX (JEOL, Япония), зав. № EM 156134-04	Увеличение × 300 до × 100000	Разрешение по точкам 3.8 Å и по линиям 2 Å	Сертификат № EM 18807 от 18.02.1987 г.
3	Элементный анализ клеток и частиц	Система рентгеновского микроанализа INCA Energy TEM (Oxford Instruments, Великобритания), зав. № 70217	Анализ элементов от бериллия до плутония	Разрешение по Mn Ka127 эВ	Свидетельство о поверке 2265000761901 66989 от 17.03.2015
4	Размер и флуоресценция клеток	Axiolmager D1 (Carl Zeiss, Германия), сер. № 3513000187	Размер частиц 0,5-150 мкм	Погрешность измерения ± 0,1 мкм	Акт о проверке 14213 от 16.01.2017